



第103回 OPERA研究交流セミナー  
第96回 ISIT有機光エレクトロニクス研究特別室セミナー  
第163回 未来化学創造センターセミナー



日時:2014年2月13日(木) 15:00-17:30

場所:九州大学 最先端有機光エレクトロニクス研究棟 3F会議室

「有機エレクトロニクスに関する最新評価法のご紹介;(株)住化分析センター」

15:00~16:00 ポスターセッション 第一部 \* 入退室自由

16:00~16:40 口頭発表

1. 住化分析センターのご紹介 取締役 電子事業部長 金丸 博

2. 技術プレゼンテーション

(1)「軟X線吸収分析(XAS)および放射光X線回折(SAXS、WAXS)による有機薄膜の微細構造解析」

技術開発センター グループリーダー 末広 省吾

(2)「電界誘起ESR法による有機半導体のキャリア輸送評価」

技術開発センター 高橋 永次

16:40~17:30 ポスターセッション 第二部 \* 入退室自由

<ポスターセッション 展示内容>

「有機多層膜の高倍率観察」

「有機薄膜の結晶構造観察」

「リン光材料の発光ドーパント分布」

「塗布プロセスの残留溶媒」

「有機EL材料の劣化評価」

「有機薄膜の分子配向性評価」

「有機材料中のハロゲン分析」

「有機材料中の微量金属汚染評価」

「Ir(ppy)<sub>3</sub>の不純物解析」

「機能性フィルムのガス透過試験」

「シール部のバリア性評価」

「有機材料の伝熱性能評価」

\* その他分析・解析技術も展示予定です。

主催:九州大学 最先端有機光エレクトロニクス研究センター

:財団法人九州先端科学技術研究所(ISIT)

共催:九州大学 未来化学創造センター